

- [1] Воронин В.И., Давыдов С.А., Карькин А.Е. и др. // Письма в ЖЭТФ. 1987. Т. 46 (Приложение).
- [2] Алексеенко Б.В., Букалов А.В., Галушка В.П. и др. Тез. докл. II Всес. конф. по высокотемпературной сверхпроводимости. Киев, 1989. Т. 111, 245 с.
- [3] Александров О.В., Казаков И.П., Киселева К.В., Максимовский С.Н., Шотов А.П. Тез. докл. 7-й Всес. конф. по росту кристаллов. М., 1988. Т. 11. С. 380-381.
- [4] Sava R.J., Botlogg B., Sunshine S.A. et al. // Physica C. 1988. P. 153-155; P. 560-565.

Поступило в Редакцию  
3 июля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 18      26 сентября 1990 г.  
07; 12

© 1990

#### ЯВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГИЛЬБЕРТ-ОБРАЗА ПУЧКА ИЗЛУЧЕНИЯ В ИЗОБРАЖЕНИЯХ ФРЕНЕЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТРАНСПАРАНТА

Э.Н. Балашова, М.В. Неофитный,  
В.А. Свич

Известны дифракционные элементы для выполнения преобразования Гильберта в зоне Фраунгофера [1-2]. Однако задача безлинзового формирования Гильберт-образа (ГО) в зоне дифракции Френеля оставалась нерешенной вплоть до появления работ [3, 4], в которых описан эффект отображения ГО в изображениях Френеля фазового транспаранта, состоящего из двух участков с различными значениями отношения поперечных размеров канавок к периоду их расположения. Указанный эффект позволяет упростить существующие схемы теневых приборов [1, 5] благодаря совмещению в одном дифракционном элементе функций фильтра Гильберта и фокусирующего устройства. Недостатком существующих дифракционных элементов, выполняющих преобразование Гильберта в зонах Френеля и Фраунгофера, является значительная зависимость качества формируемого изображения от смещения центра транспаранта относительно оси пучка. Указанное смещение приводит к появлению фона, интенсивность которого пропорциональна квадрату смещения.

В настоящей работе сообщается о явлении формирования ГО в изображениях Френеля периодического транспаранта (ПТ), позволяющем устранить влияние децентровки на качество выполняемого интегрального преобразования. Данное явление заключается в том, что ГО пучка формируется в дискретном множестве плоскостей наблюдения, удаленных от ПТ на расстояние  $Z_{pm}$ , определяемое выражением

$$Z_{pm} = \frac{mT^2}{\rho\lambda}, \quad (1)$$

где  $T$  – период расположения перегородок транспаранта,  $m=1, 2, 3 \dots < \frac{N}{4}$ ,  $2N$  – число периодов,  $\rho=1, 2, 3 \dots < \frac{mT}{\lambda N}$ ,  $\lambda$  – длина волны излучения. Координаты  $\tilde{x}_{lpm}$  формирования Гильберт-полос находятся за пределами основного пучка и отсчитываются относительно проекции центра ПТ на плоскость наблюдения изображения Френеля, согласно выражению

$$\tilde{x}_{lpm} = \frac{T}{\rho} \left\{ l + \Delta + 0.25 [1 - (-1)^{\rho m}] \right\}. \quad (2)$$

Здесь  $l$  определяет номер дифракционной полосы и равно округленному до целого числа  $mT/d$ , взятому с положительным или отрицательным знаком,  $d$  – ширина щелей,  $\Delta = 1/2Nm$ . В выражении для комплексной амплитуды дифрагированного на ПТ поля по отношению к координатам (2) можно выделить произведение знаковой функции  $sgn(x)$  на функцию амплитудно-фазового распределения падающего пучка  $U(x)$  и тем самым выполнить необходимое условие осуществления преобразования Гильберта. Последнее утверждение справедливо для осесимметричных пучков, у которых  $U(|\frac{NT}{2} + x_n|) \approx \approx U(|\frac{NT}{2} - x_n|)$ ,  $n$  – индекс нумерующий щели,  $-N \leq n \leq N$ . С учетом вышесказанного, выражение для комплексной амплитуды поля, прошедшего через ПТ, у которого  $d \ll T$ , в плоскостях  $Z_{p1}$  получено в виде

$$U(\tilde{x}, Z_{p1}) = C(\tilde{x}, Z_{p1}) \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - nT) U(x) i \operatorname{sgn}(x) \times \\ \times \sin\left(\frac{2\pi|x|\Delta}{T}\right) \operatorname{rect}\left(\frac{x}{2NT}\right) \exp\left[\frac{ikx}{Z_{p1}}(\tilde{x} - \tilde{x}_{lpm})\right] dx, \quad (3)$$

$$\text{где } C(\tilde{x}, Z_{p1}) = \frac{-\exp\left[ik\left(Z_{p1} + \frac{\tilde{x}^2}{2Z_{p1}}\right)\right]}{(i\lambda Z_{p1})^{1/2}}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

Данное выражение записано без учета конечности размеров ширины щелей. После выполнения преобразования Фурье от произведения функций представим (3) следующим образом:

$$U(\tilde{x}, \tilde{z}_{p1}) = C_1(\tilde{x}, \tilde{z}_{p1}) \hat{U}\left(\frac{\tilde{x}}{\lambda \tilde{z}_{p1}}\right) \otimes \text{isgn}^{\wedge}\left(\frac{\tilde{x}}{\lambda \tilde{z}_{p1}}\right) \times \quad (4)$$

$$\times \otimes \sum_{q=-\infty}^{\infty} \delta\left[\frac{\tilde{x}}{\lambda \tilde{z}_{p1}} - \frac{qT + \Delta \text{sgn}(q)T + \rho \tilde{x}_{z_{p1}}}{T^2}\right] \otimes \text{sinc}\left(\frac{2NT\tilde{x}}{\lambda \tilde{z}_{p1}}\right).$$

Здесь  $\otimes$  - операция одномерной свертки, знак уголок над функциями обозначает преобразование Фурье этих функций по частоте  $\frac{\tilde{x}}{\lambda \tilde{z}_{p1}}$ ,  $C_1(\tilde{x}, \tilde{z}_{p1}) = \frac{C(\tilde{x}, \tilde{z}_{p1})}{iT}$ . При  $T \ll NT$  функция  $\text{sinc}\left(\frac{2NT\tilde{x}}{\lambda \tilde{z}_{p1}}\right)$  аппроксимируется  $\delta$ -функцией. В этом случае (4) преобразуется к виду

$$U(\tilde{x}, \tilde{z}_{p1}) = C_1(\tilde{x}, \tilde{z}_{p1}) \sum_{q=-\infty}^{\infty} \hat{U}\left(\frac{\tilde{x}}{\lambda \tilde{z}_{p1}} - \frac{qT + \Delta \text{sgn}(q)T + \rho \tilde{x}_{z_{p1}}}{T^2}\right) \times$$

$$\times \otimes \text{isgn}^{\wedge}\left(\frac{\tilde{x}}{\lambda \tilde{z}_{p1}} - \frac{qT + \Delta \text{sgn}(q)T + \rho \tilde{x}_{z_{p1}}}{T^2}\right). \quad (5)$$

Из (5) следует, что в случае, когда угловая ширина дифракционных полос значительно меньше  $\frac{\lambda}{T}$ , вблизи координат наблюдения  $\tilde{x}'_{z_{p1}} = \tilde{x}_{z_{p1}} + \frac{\text{sgn}(q)\Delta T + qT}{\rho}$  формируется ГО, представляющий собой, согласно [1], свертку  $\hat{U}\left(\frac{\tilde{x}}{\lambda \tilde{z}_{p1}}\right) \otimes \text{isgn}^{\wedge}\left(\frac{\tilde{x}}{\lambda \tilde{z}_{p1}}\right)$ . Ограничение малости ширины щелей по сравнению с периодом  $T$  их расположения приводит к модуляции комплексной амплитуды ГО в (5) функцией  $\text{sinc}\left[\frac{q(T-d)}{T}\right]$ .

При доказательстве формирования ГО в плоскостях, соответствующих  $m \neq 1$ , ПТ по отношению к координате  $\tilde{x}_{z_{pm}}$  разбивается на  $m$  групп щелей с периодом  $mT$ . Если каждая группа в достаточной степени перекрывает поперечное сечение пучка и угловая ширина ГО значительно меньше  $\frac{\lambda}{mT}$ , то в указанных плоскостях будет наблюдаться то же явление, что и в выражении (5). Зависимость качества формирования ГО от числа щелей при  $m$ , равным нескольким единицам, имеет оптимум.

На рис. 1, а приведены численные результаты, позволяющие провести сравнение относительного углового распределения интенсивности в дифракционной полосе, образующейся на расстоянии, задаваемом (1), при  $\rho=1$ ,  $m=1$ , с аналогичным распределением ГО, полученного при падении пучков с функциями амплитудного распределения видов

$$U(x) = \text{rect}\left(\frac{x}{a}\right), \quad (6)$$

$$U(x) = \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right), \quad (7)$$

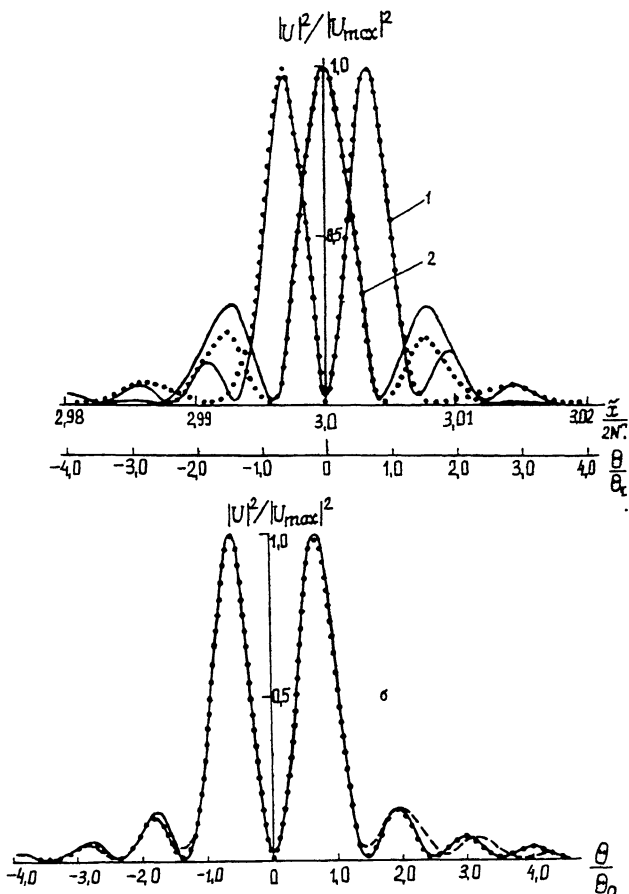


Рис. 1. Относительное распределение интенсивности излучения,  $N=10$ ,  $\frac{T}{\alpha}=20$ ; а - 1 - пучок (6), 2 - пучок (7); б - децентрировка транспаранта, 1 -  $\Delta x = \frac{T}{3}$ , 2 -  $\Delta x = \frac{T}{4}$ , 3 -  $\Delta x = \frac{T}{2}$ .

где  $\alpha = 2NT$  - характерный размер пучка. Сплошной кривой показано относительное распределение интенсивности в дифракционной полосе зоны Френеля. Точки соответствуют второму дифракционному порядку транспаранта, выполняющего в зоне Фраунгофера преобразование Гильберта пучка вида  $\hat{U}\left(\frac{\tilde{x}}{\lambda z}\right)$ . Для сравнения с соответствующим распределением ГО при дифракционной полосе зоны Френеля приведена угловая координата  $\frac{\theta}{\theta_0}$ , где  $\theta_0 = \frac{\lambda}{2NT}$ ,  $\theta = \frac{\tilde{x}}{z_{11}}$ . Из графиков следует, что в угловом распределении интенсивности полосы Френеля, номер которой равен  $2Q$  и совпадает с выбранным отношением  $\frac{T}{\alpha}$ , формируется ГО пучка. В плоскостях наблюдения, со-

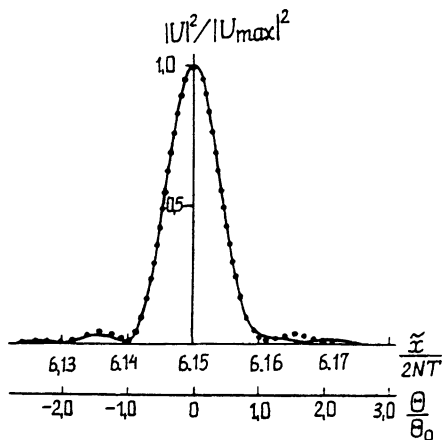


Рис. 2. Сравнение относительного углового распределения интенсивности в полосе Френеля при  $N=10$ ,  $T/d=20$  (1) с диаграммой направленности пучка (6) в дальней зоне (2).

гласно (1), Гильберт-полосы расположены с периодом  $T/p$ , причем при  $p \neq 1$  происходит их мультиплицирование с коэффициентом, равным  $p$ .

Описанный транспарант устраняет влияние децентровки на формирование ГО.

Сказанное подтверждается графиками распределений интенсивности на рис. 1, б, полученными в плоскости  $Z_{11}$  при различных значениях смещения  $\Delta x$  центра ПТ относительно оси пучка (6). Видно, что децентровка не приводит к заметному искажению картины ГО.

Функции данного ПТ не ограничиваются описанным интегральным преобразованием Гильберта. При дальнейшем увеличении номера  $Z$  дифракционной полосы ГО трансформируются в Фурье-образы, что расширяет границы наблюдения приведенного в [7-10] безлинзового преобразования Фурье в изображениях Френеля. Пример формирования Фурье-образа пучка в 51-й полосе изображения Френеля, расположенного на расстоянии  $Z_{12}$  от ПТ, показан на рис. 2. Из приведенного графика следует, что в относительном угловом распределении интенсивности полосы Френеля воспроизводится Фурье-образ пучка.

### С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Сороко Л.М. Гильберт-оптика. М.: Наука, 1981. 159 с.
- [2] Е и J.K.T., Л о h т а n n A.W. // Opt. Commun. 1973. V. 9. N 3. P. 257-260.
- [3] Б а л а ш о в а Э.Н., Н е о ф и т н ы й М.В., С в и ч В.А. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 18. С. 55-59.
- [4] Б а л а ш о в а Э.Н., Н е о ф и т н ы й М.В., С в и ч В.А. // Тез. докл. У1 Всес. конф. „Оптика лазеров“. Л., 1990. 270 с.
- [5] К о с о б у р д Т.П. Кандидатская диссертация. Горький, 1984.
- [6] Е п и ш и н В.А., Н е о ф и т н ы й М.В. // Квантовая электроника. 1982. Т. 9. № 4. С. 718-725.
- [7] Е п и ш и н В.А., З а с л а в с к и й В.Я., Н е о ф и т н ы й М.В. // Тр. НИЦТЛ АН СССР. 1986. С. 200-205.

- [8] Смирнов А.П. // Оптика и спектроскопия. 1987. Т. 62, В. 3. С. 636-643.
- [9] Епишин В.А., Нефитный М.В. // Оптико-механическая промышленность. 1989. № 4. С. 4-5.

Харьковский государственный  
университет им. А.М. Горького

Поступило в Редакцию  
25 мая 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 18

26 сентября 1990 г.

05.4; 12

© 1990

## НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ШУМ ТОЛСТЫХ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ СЛОЕВ

В. Паленский, З. Шоблицка,  
Р. Симанавичюс, Б. Венгалис

Исследование флуктуационных процессов в пленках высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) ведется в основном по двум направлениям: флуктуациям магнитного потока и токовому шуму. Эти измерения имеют не только большую научную значимость для понятия физических явлений ВТСП, но и большое практическое значение при создании очень чувствительных приборов криоэлектроники и приемников инфракрасного и микроволнового излучения. Спектральная плотность флуктуаций напряжения (при протекании постоянного тока) для ВТСП пленок в большинстве случаев (например, для пленок  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  [1] и  $ErBa_2Cu_3O_7$  [2]) увеличивается с возрастанием сопротивления в области перехода из сверхпроводящего состояния в нормальное, а далее или насыщается [2], или возрастает, причем это наблюдается даже до комнатных температур [1] и выше [3]. Монотонный рост низкочастотного шума типа  $1/f$  с температурой объясняется увеличением доли нормальных участков, структурные дефекты которых обуславливают появление избыточного шума, как это имеет место для неоднородных материалов.

В настоящей работе исследованы зависимости сопротивления и спектральной плотности флуктуаций напряжения от величины постоянного тока, слабого магнитного поля и температуры в области сверхпроводящего перехода толстых ( $\sim 22$  мкм) поликристаллических  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  слоев. Исследуемые  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$  слои изготовлены на керамических подложках диэлектрического соединения  $Y_2BaCuO_5$ . На поверхность таблеток  $Y_2BaCuO_5$  наносили порошки смеси окислов  $BaO$  и  $CuO$  в молярном соотношении 3:5; при температуре 1200 К обеспечивалось протекание реакции:  $Y_2BaCuO_5 + 3BaO + 5CuO \rightarrow 2YBa_2Cu_3O_{7-x}$ . Методика приготовления таких слоев